

Besprechung Kapitel 4

- Introduction: perille Rekonstruktion mit Industrieanwendung begründen (EUV Lithographie)
- Einfluss der optischen Konstanten auf die Strukturparameter
- "theoretisches Limit" Reflektivität definieren (S. 45, Kap. 4)
- nominelle Schichtdicke definieren (S. 52)

Besprechung Kapitel 5.1

- Detektorwinkelbezeichnung einheitlich (θ vs. α)
- Bragg-like lines vs. Bragg-like peaks illustrieren

- mismatch zwischen Bragg-like peaks und Daten erklären

- Fig. 58: Herkunft der Parameter erklären Kap 4 + Richtigkeit von später

- Hurst-factor Visualisieren, β und

- Parameterresultate ausführlicher diskutieren. Was bedeutet das Ergebnis

- Ende Kapitel 5.1: jetzt ist das Handwerkszeug

zu den Unsicherheiten:

Dichte ist die Freiheit

Besprechung Kapitel 5.2 - 5.8

- mehr den Leser mitnehmen
- zu 4.14 (Fig) blaue Linie in Caption erklären
- Gaussian-type roughness \Leftrightarrow Hurst (Externe zeigen)
- klarer Bezug zu Symbolen und Zahlen, Tabellen
- 5.2.2. deutlich ausweiten
enthält die wesentlichen Ergebnisse:
Was die Effekte im Bild
(z.B. 5.17) zunächst erklären
und dann deuten
- Wenn etwas wiederholt wird,
erklären warum. Lieber Referenzen beibehalten

Besprechung Kapitel 3 Fraun

- Einleitung überarbeiten
- $E_c \rightarrow$ Wien, $E \rightarrow$ Planck
- FEL sauberen
- SX200 vs. EURE optimized for different spectral ranges
- E vs. θ diagram rocking curve
- 1456 for Si-edge
- wahr small high spectral fig.
mid-species. terrible